**Табела 9.1.** Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Име, средње слово, презиме** | | | | | | | **Снежана М. Ђорић-Вељковић** | | | |
| **Звање** | | | | | | | Ванредни професор | | | |
| **Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када** | | | | | | | Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, од 01.09.2000. године | | | |
| **Ужа научна односно уметничка област** | | | | | | | Примењена физика | | | |
| **Академска каријера** | | | | | | | | | | |
|  | | | Година | Институција | | | | Област | | |
| Избор у звање | | | 2011. | Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет | | | | Физичке науке | | |
| Докторат | | | 2006. | Универзитет у Нишу, Електронски факултет | | | | Електротехничко и рачунарско инжењерство | | |
| Магистратура | | | 1994. | Универзитет у Нишу, Електронски факултет | | | | Електротехничко и рачунарско инжењерство | | |
| Диплома | | | 1988. | Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, студијска група за физику | | | | Физичке науке | | |
| **Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа** | | | | | | | | | | |
|  | | Назив предмета | | | | Назив студијског програма, врста студија | | | | Часова активне наставе |
| 1. | | Грађевинска физика | | | | ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО | | | | 0,6 |
| 2. | | Термотехничке и електричне инсталације | | | | ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО | | | | 1 |
| 3. | | Инсталације у зградама | | | | ИАС АРХИТЕКТУРА | | | | 0,2667 |
| 4. | | Физика зграда | | | | ИАС АРХИТЕКТУРА | | | | 0,2667 |
| **Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)** | | | | | | | | | | |
| 1. | D. Danković, I. Manić, A. Prijić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, Z. Prijić, and N. Stojadinović, "Effects of static and pulsed negative bias temperature stressing on lifetime in p-channel power VDMOSFETs", *Informacije Midem-Journal of Microelectronics Electronic Components and Materials*, vol. 43, iss. 1, pp. 58-66 (2013) | | | | | | | | | |
| 2. | S. Djorić-Veljković, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Annealing of Radiation-Induced Defects in Burn-in Stressed Power VDMOSFETs", *Nuclear Technology & Radiation Protection,* vol. 26, no. 1, pp. 18-24 (2011) | | | | | | | | | |
| 3. | I. Manić, D. Danković, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Effects of Low Gate Bias Annealing in NBT Stressed p-Channel Power VDMOSFETs", *Microelectronics Reliability*, vol. 49, pp. 1003 - 1007 (2009) | | | | | | | | | |
| 4. | D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Negative Bias Temperature Instability in n-Channel Power VDMOSFETs", *Microelectronics Reliability*, vol. 48, pp. 1313 - 1317 (2008) | | | | | | | | | |
| 5. | I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović and N. Stojadinović, "Mechanisms of Spontaneous Recovery in DC Gate Bias Stressed Power VDMOSFETs"*, IEE Proc. - Circuits, Devices and Systems,* vol. 155, pp. 281-288 (2008) | | | | | | | | | |
| 6. | D. Danković, I. Manić**,** V. Davidović, S. Djorić-Veljković**,** S. Golubović, N. Stojadinović, "Negative Bias Temperature Instabilities in Sequentialy Stressed and Annealed in p-Channel Power VDMOSFETs", *Microelectronics Reliability*, vol. 47, pp. 1400 - 1407 (2007) | | | | | | | | | |
| 7. | С. Голубовић,С. Ђорић-Вељковић, И. Maнић, В. Давидовић, “Eфекти напрезања оксида гејта VDMOS транзистора снаге”, *Moнографија*, Eлектронски факултет Ниш, 2006. | | | | | | | | | |
| 8. | N. Stojadinović, I. Manić**,** V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, S. Golubović and S. Dimitrijev, "Electrical Stressing Effects in Commercial Power VDMOSFETs", *IEE Proc.- Circuits, Devices and Systems,* vol. 153, pp. 281-288 (2006) | | | | | | | | | |
| 9. | N. Stojadinović, I. Manić**,** V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković**,** S. Golubović and S. Dimitrijev, "Effects of Electrical Stressing in Power VDMOSFETs", *Microelectronics Reliability*, vol. 45, pp. 115-122 – invited paper (2005) | | | | | | | | | |
| 10. | S. Djorić-Veljković, I. Manić**,** V. Davidović, S. Golubović and N. Stojadinović, "Effects of Burn-in Stressing on Post-Irradiation Annealing Response of Power VDMOSFETs", *Microelectronics Reliability*, vol. 43, pp. 1455-1460 (2003) | | | | | | | | | |
| **Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника** | | | | | | | | | | |
| Укупан број цитата | | | | | 52 | | | | | |
| Укупан број радова са SCI (SSCI) листе | | | | | 23 | | | | | |
| Тренутно учешће на пројектима | | | | | Домаћи 1 | | | | Међународни | |
| Усавршавања | | | | |  | | | | | |
| Други подаци које сматрате релевантним - Од 2009. до 2012. год. - члан радне групе за организовање заједничких докторских студија (Preparation group for joint doctoral studies) које би организовали грађевински факултети из Београда, Ниша и Скопља заједно са Ruhr Univerisity Bochum из Немачке у оквиру SEEFORM - DAAD пројекта  - Од 1996. год члан међународног удружења IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers  - 2004. године друга награда Министарсва за науку и заштиту животне средине за постигнуте резултате у науци  - Учешће у реализацији пет домаћих и два међународна пројекта  - У току 2003. год. и 2004. год. члан тима међународног пројекта Енергетска ефикасност ѕграда у југоисточној Европи, са циљем едукације архитеката и инжењера, на којем су учествовали: Архитектонски факултет у Скопљу, Техничка висока школа из Берлина и Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, а под покровитељством DAAD-а (Немачка) и Пакт-а за стабилност југоисточне Европе. | | | | | | | | | | |